

環境制御型走査型プローブ顕微鏡 (E-sweep)



メーカー	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社
型式	E-sweep
概要	<p>走査型プローブ顕微鏡 (Scanning Probe Microscope: SPM) は、微小な探針 (プローブ) で試料をなぞって、その形状や性質を観察することができる顕微鏡の総称です。</p> <p>利用例としては原材料等に微細加工を施した際の実態状況の確認、または微細加工製品の不良原因の分析、化合物の状態の分析・評価等に活用できます。</p> <p>E-sweepは真空や温度などの環境制御ニーズに対応でき、高真空状態での磁気力計測や、加熱・冷却状態での試料の物性マッピング等が可能です。</p>
仕様	<p>検出方式：光てこ方式</p> <p>測定モード：AFM、DFM、VE-DFM、LM-FFM、MFM アドヒージョン</p> <p>走査範囲：X、Y20μm、Z1.5μm (20μmスキャナ) X、Y100μm、Z15μm (150μmスキャナ)</p> <p>試料サイズ：ϕ25mm未満、厚さ 最大10mm (試料台含)</p> <p>測定環境：大気中、真空中、温度制御</p> <p>測定可能項目：表面形状、位相観察、表面粗さ、 粒子解析、摩擦力分布、磁気力分布、 粘着力分布</p>
オプション	カンチレバーは別途購入、または持ち込みも可能
設置場所	地域産学連携研究センター 装置室A
利用料	2,970円/時間 (税込)
連絡先	<p>予約、利用相談は電話又はメールにてお問い合わせください。 044-934-7250 (内線7250)</p> <p>cii●mics.meiji.ac.jp (●の部分をもに置き換えてお送りください)</p>